

## XRR 解析レポート

## プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403

点数: 1451

2 $\theta$ (°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000

ステップ = 0.004

オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム

データ間隔: 1点ごとにフィッティング

残差タイプ:  $|\Delta(\text{LogI})|$ 

母集団: 50

個体数: 50

ターゲット $\chi^2$ : 1.00e-004

重み: 50%

クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数

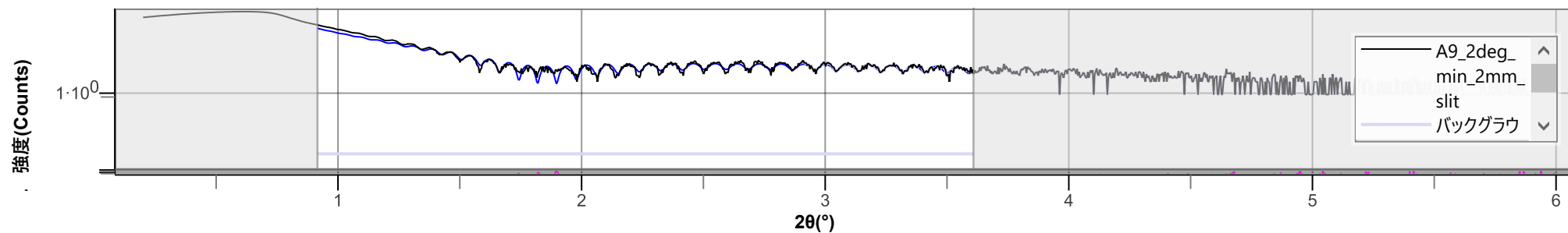
ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002

ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

## プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm <sup>3</sup> )<d>	粗さ(nm)<rg>
<input checked="" type="checkbox"/>	L5	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.995 Const ±0.03 精密化	2.47500 Const	0.994 Con... ±0.02 精密化
<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.420 Const ±0.06 精密化	4.95000 Const	0.121 Con...
<input type="checkbox"/>	L3	Fe	0.000 Const ±0.2 最小ー 精密化	4.63772 Const	6.329 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	93.319 Const	7.86952 Const	0.499 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	2.025 Const ±0.9 精密化	3.93700 Const	0.466 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...